

昭和49年5月23日

特許庁長官

- がオショリガガウ 防汚処理方法 1. 発明の名称
- : 明 看 ヨンマシアサエクサコンヤマ 住 所 神奈川県 横浜市 旭 区左近山 1367 (他 2 名)

3. 特許出願人

東京都大田区下丸子3-30-2 (100) キャノン株式会社

> 代表者 御 手 洗 (他 0 名)

4. 代 理 人

東京都大田区下丸子3-30-2 ャノン株式会社内。

(6987) 弁理士 丸 島

5. 添附書類の目録



1. 発明の名称

防污処理方法

2. 特許請求の範囲

3.発明の詳細な説明

SiOを主成分とする光学部材表面に、一般式 R<sub>6</sub>SiX (式中 S<sub>6</sub>は炭素数 1 乃至 10 のフルオルア ルキル基であり、Xはハログン又はアルコキン 基である)で示される含プツ素シラン化合物を 反応形成させるととを特徴とする防汚処理方法。

本発明は光学部材の防汚処理方法に係り、特に 粉嚷、蒸気雰囲気中での光学部材表面の汚染を 有効に防止可能とする防汚処理方法に関するも のである。

従来、複写機等の光学部材は、粉塵、蒸気等に よる汚染に対し積極的な対策は成されていなか (19) 日本国特許庁

## 公開特許公報

①特開昭 51-1387

昭51. (1976) 1. 8 43公開日

②的特願昭 49-58069

②出願日 昭49.(1974)5.23

審査請求 未請求 (全5頁)

广内整理番号

7003 4A 7172 23

**120日本分類** 

1391E6 104 A71 (51) Int. Cl<sup>2</sup>. CO9K 3/22 CO3C 17/30.

, つた。しかし、近来急速に複写機の高速化が進め られるにつれ、従来問題にならなかつた粉雕、蒸 気等の影響が極めて大きくなつた。というのも従 来、複写機現像部、定着部、クリーニング部から 発生する粉塵或は蒸気は、密封したフィルター等 を用いて回収し、或は送風により排気することに「 より、光学部材への影響を軽減していたが、コピ - の高速化により従来構成では光学部材への影響 が大となつてきた。この様に種々の要因によつて 光学系構成部材の表面が汚染された場合、除々に 感光ドラム表面の感光体の光導電層に到達すべき 映像の照度低下を招く。その結果感光体の光導電 層上の電位の低下に伴つて電位差が小さくなるた め、複写された画像は一般にカプリを生ずると共 に、濃度差が出にくい傾向を示し、当然解像力も 低下する。との様な複写機の本質的な機能を低下

させる効果以外にも、光学系構成部材姿面の汚染は例えば使用頻度が増すに従つて要面の清浄度を維持するための保守管理回数及び費用が増さざるを得ないこと、そして通常光学系構成部材が復写機内に占める許容空間がせまいために、溶剤と布紙等で行う清掃作業が積めて行いにくい等のメンテナンス上極めて重大な問題となつているのが現状である。

本発明は上記の点に鑑み、光学部材の光学特性を損うことなく、該部材表面の清浄度を極めて長期間維持しりる防汚処理方法を提供せんとするものである。

本発明を略述すると、ガラス組成物よりなる光 学部材の少なくとも該表面を低表面張力化するも ので、しかも低面張力物質層が該表面と反応し強 ② 低結合した層を形成せしめたものである。

( CH, ), St-O-(St-O)-St(CH, ), .....(I)

則わち、SiQtを主成分とする光学部材表面に、一般式 RfSiX (式中 Rf は炭素数 1 乃至 10 のフルオルフルキル基であり、X はハロゲン又はブルコキシをである)で示される含フツ索シラン化合物を反応形成させるものである。

СН

また弗果系低表面張力物質として、パーフルオル
カルボン酸のクロム錯塩 [ Rf.CooCr, OH)\* + (Rf=
CF, ~C, F, ) (例:商品名。FC 804,スリー M社製)
アクリル酸のフルオルアルキルエステルの重合物
[ -CH, -CH(Coo CH, Rf)-] a (Rf'= C, F, ~C, F, )
(例:商品名、スコツチガード、スリー M社製),
ポリー IH . IH - ベンタデカフルオルオクチルメ
タアクリレート (例:商品名。FC 706 スリー M社製)
同じくパーフルオルアルキルエステルの重合物
OCCCR - CH, CH, CH, CHCH, COOCH - CH, OH

R4SO<sub>2</sub> (例:商品名 FP - 81, 住友化学社製) 中 (BfSo<sub>2</sub> NR<sub>4</sub> OCCR<sub>4</sub> = CH<sub>4</sub>)(Rf は C<sub>4</sub> F<sub>7</sub> ~C<sub>10</sub> F<sub>21</sub>, R<sub>6</sub> はCH<sub>7</sub>~ R<sub>4</sub> O

C. Ha, Rath 又は CHa 基を示す) の共重合体( 例允 1 商品名 Fe-905, スリー M社, 商品名 FPX-2010 ダイキン社製)等があげられる。しかしと れらの物質はガラス基体の表面に形成された被膜 の表面張力は十分な特性を示すが基体との結合力 に乏 しく MDK アセトンあるいは石油系帝剤等を用 いたフキ作業あるいは洗浄操作に十分な耐久性を 示さない欠点を共通に有し少なくも複写機光学系 の防 汚 ガラス 表面処理 剤としては十分な 特性を有 する ものでない。この様に単に低面張力物質を形 成さ せるのみでは実用上十分なる効果を期待し難 いものである。従つて本発明に明示した如く、基 体と 強戚な結合を示す低表面張力物質を形成して / 季前 の表面には極めて結合力が強く且つトナー液体、 初めて所望の効果を実現するものである。それ故 本発明処理方法に於いて、基板処理は極めて慎重 に用り<sub>人</sub>ことが必要で、その処理はガラス組成物、

即ち、SiOoを主成分として含む基体表面をアルカ り洗浄を行つて清浄化しその後酸洗いをして温風 乾燥した後、あらかじめ一般式 RfSiX で示される 合弗系シラン化合物を 50ppm~1500 範囲に稀 駅 調整した溶液中に浸漬するかまたは、それらを筆 またはスプレーによつてコーテイングし、その後 常温~150℃ の範囲で乾燥させ被膜を形成させる ととによつて達成される。上述操作の内最も重要 なことは、SiOeを主成分として含む基体表面の情 浄の度合いであり、注意探く行う必要があること は前記の通りである。との様にRfSiXなる含弗系 シラン化合物で処理された酸光学装置、構成部材 気化した密剤あるいは複写機内容からの粉塵等に よつて容易に汚染されにくい表面層が形成される ことになる。本物質の他の特徴としては、飲砂間

のディッピングあるいはハケ敵り等の手段で処理 可能な経済性と共に形成される結合被膜が極めて 強閥に結合される結果、耐摩耗性が着しく大なる こと、更に形成される被膜は数ミリミクロンのオ - ダーで処理可能なため透過率等の光学的性能を ほとんど低下させないこと等の多くの利点を有す

以下本発明の理解を実に容易とするため、実施 例により説明する。各実施例に於て比較される光 学部材は、実用複写装置の構成要素で、光学系を シェルする防汚ガラス12、光学系のインナーミ ラーレンズ3及び反射ミラー4を使用した。

防汚ガラス1かよび2の材質は1 = 厚さの青板ガ タスを用いたアルカリ洗浄液には、あらかじめ 2 %濃度に調整したエクストラン溶液(メルク社の商品名)

を50℃に加温した液中に 60分間浸渍し、次いでas NのHCI水溶液を用いて製洗いした後、十分な水 洗いを行い乾燥する。一方含弗系シラン化合物に は、 レ- 1668 (商品名:スリーM社製)、および FPX -1618 (商品名;ダイキン社製)を用い、そ れぞれダイフロン S2 (ダイキン社製・商品名)に、 よつて稲釈し、50, 100,200,400,および800ppm の 各濃度に調整した。とれらの液中に前配の如く用 意した防汚ガラス 1 及び 2 を数秒浸漬した後<sup>30</sup>人×in の速度で引き上げた後 100 ℃の雰囲気とした乾燥 器中で10分間熱処理を行つた。との様に調整した 防汚ガラスを前記した複写装置に組み込み、2万 枚のランニングテストを行つた後の透過率の変化 で防汚性能を評価した。比較資料は同様な前処理 を行つた無被覆のガラス板とした。結果を表-1 に示したが本発明の処理を施した防汚ガラスの透

特開 昭51--- 1387(4)

過率 変 化は 無処理の ものに比較して極めて少ない こと が わかる。

	表 如理液	<b>- 1</b>	0.	
	读度 ppm	初期透過率%	2~00枚後の透過率を	
無処 理		92	. 64	
	5 0	9 2	8 9	
FPX1518	100	92	89	
	200	. 90	. 89	
	4 00	9 0	. 87	
	800	. 89	8.4	
. •	5 0	9 2	7 6	
• .	1 0,0	92	7 9	
L- 1668	200	9 0	8 5	
	400	90 .	8 6	
	800	8.8	8.5	

## 爽施例 - 2

実験に供した試料はレンズ内部にミラーを有する インナーミラーレンズ3の最外側レンズであり、 その表面に該含弗系シラン化合物 FPX1518 を表面 処理により被腹形成させた。前処理としての洗浄 方法及びレンズ表面への処理方法は、実施例-1

結果を表 - 3 に示す。

	. ·	表 - 3		
•	処理液	•		
•	濃度 ppm	反射率 4	€ 40	0.0 0枚後の反射率第
無処理		9.8		<u>8</u> 1
-	5 0	9 8		9 6
L- 1668	100	9 7		. 97
•	200	9 6		9 6
	400	96	:	9 4
	800	94		9 3

各実施例の結果からも明らかな様に本発明に係る 該含フン系シラン化合物を低表面張力物質として 核光学系構成部材の表面に形成させた場合、無処 理のものに比較して明らかな防汚効果の海海度 ととがわかる。もちろん前記した処理液 み度 確立 るならば光学的性能も何ら低下しない稀薄 過度で自 められたが、処理液濃度がこの様に称薄 過度で自 かよいう長所は単に処理費用低減のための経済的 分果及び前記の光学的効果以上に、稀薄 過度であればあるほど被処理物に彼ムラで生ずる処理複 ればあるほど被処理物に彼ムラで生ずる処理額 と同様に行つた。結果を表 2 に示す。表 2 のデーターは試験前のインナーミラー 最外側レンズの透過率と試験後の該レンズの透過率により比較したものである。

	表 - 処理液	2 レンズの	レンズの
·	農度 ppm	初期透過率多	2000枚後の透過率多
無処理		9 5	8.4
•	5 0	. 95	· , 93
FPX1518	100	9 4	9 4
	200	. 92	9 2
	400	9 2	91 -
	800	8.9	89

**夷施例** -:

本実施例ではミラー 4 を試料として取り上げ、前記実施例で行った試験枚数では顕著な差が得られなかった為 40000 枚テストを行った後の反射率の差により防汚性能を評価した。洗浄方法及びミラー 装面への該合フッ素シラン化合物 L-1668 の処理方法は実施例 - 1 の場合と全く同様である。

の不均一を防止できる効果が得られることが上げられる。この効果は他の多くの低表面侵力処理手段が通常多くの注意力と工程数あるいは使用を伴うのに比較して工業上極めて有効であるといえる。

「が添しかも本発明」に基けば、各用途に於て褒めて有効 2季加なる防汚処理部材を供することを可能とするもの

出願人 キャノン株式会社 代理人 丸 岛 築 一 **ム前配以外の発明者** 

ヨンマシトツカクシモイイダマチ 住: 所 神奈川県 横浜 市戸 塚区下 飯田町 803-4

がフサキンナか・ラクがヒラマ 住 所 神奈川県川崎市中原区上平間 1488

氏名 河野 十志広

Olis, Alallable Copy

THIS PAGE BLANK (USPTO)